

電子デバイス向け 高温/低温耐久試験用恒温槽のご提案

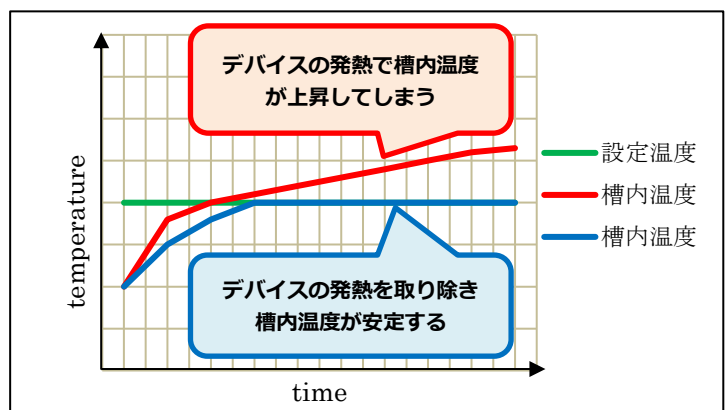
高温/低温領域における試験体発熱を伴う耐久試験や温度特性試験に対応

第5世代移動通信システム（5G）用の基地局やサーバーには、高周波対応された電子デバイス（受動素子・SAW・LCR、RFアンプなど）が使われており、情報処理量の増加や実装の高密度化による発熱を伴うことから、デバイス単体の信頼性評価や温度特性評価が必要とされます。

発熱を伴う評価を行うために、安定した温度環境を実現可能とする恒温槽をご紹介します。

特長

● 試験通電時のデバイス発熱に対して安定した試験環境を提供



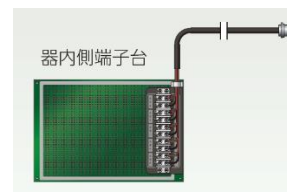
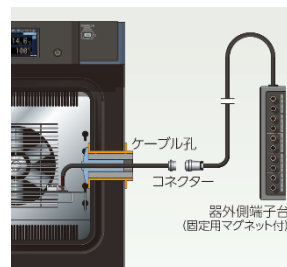
<発熱による槽内温度の比較（イメージ）>

● 計測機器との連携・連動が容易



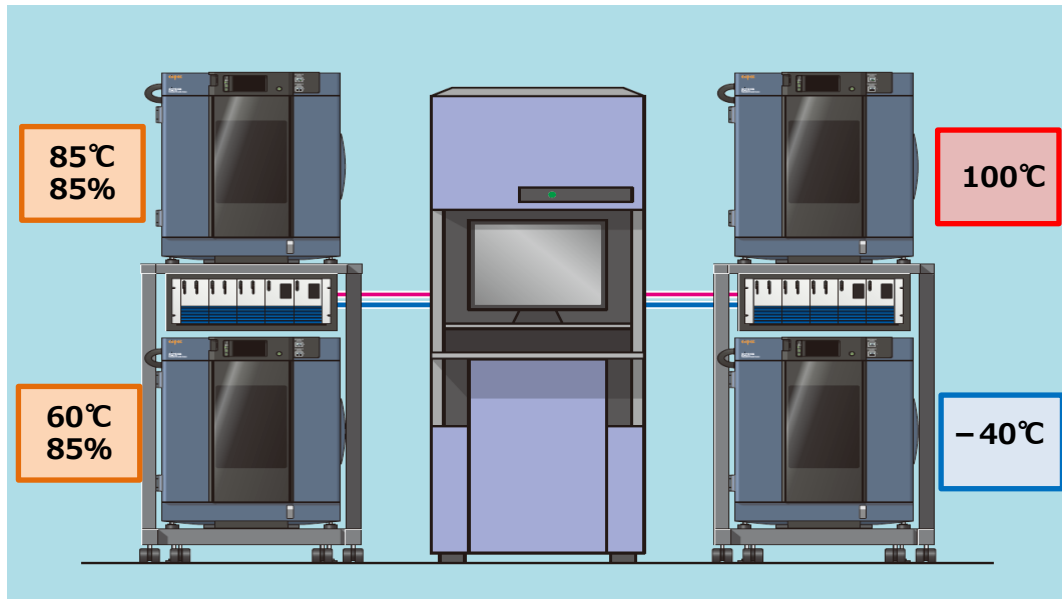
計測器運動入出力端子を装備しています。
入力端子を使えば、計測器動作と連動してプログラムパターンを動作/停止させることが可能です。

<ケーブル孔着脱式端子台（オプション）>



特長

● 同時に様々な条件で試験可能



<小型環境試験器と計測器（AMI）との接続例・試験条件 一例>

製品ラインナップ 一覧

● 省スペース化、限られた設置場所に多くの評価設備を設置することが可能 <小型環境試験器>

型式	温度範囲	内寸法 (mm) W・H・D	内容量	許容発熱負荷		
				-40℃時	+100℃時	85℃/85%時
SH-242-5	-40℃～+150℃	300×300×250	22.5L	60W	210W	60W
SH-642		400×400×400	64L	180W	280W	60W
SH-662	-60℃～+150℃			180W	280W	60W

● より発熱負荷が大きい試験に対応 <プラチナスシリーズ、ARシリーズ>

型式	温度範囲	内寸法 (mm) W・H・D	内容量	許容発熱負荷		
				-40℃時	+100℃時	85℃/85%時
PL-1J	-40℃～+150℃	500×600×400	120L	158W	1,182W	261W
PL-2J	-40℃～+150℃	700×800×400	225L	170W	2,214W	216W
PSL-2J	-70℃～+150℃	600×850×600	306L	1,134W	2,361W	265W
ARS-0220	-75℃～+180℃	700×800×400	220L	1,128W	3,435W	350W
ARSF-0250-15	-75℃～+180℃	600×830×500	250L	4,970W	8,500W	537W
ARS-0390	-75℃～+180℃	700×800×700	390L	1,129W	4,217W	300W
ARSF-0400-15	-75℃～+180℃	600×830×800	400L	4,840W	8,500W	576W

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

Tel: 06-6358-4741 Fax: 06-6358-5500

●各営業所へお問い合わせください。

●製品の改良・改善のため、仕様および外観、その他を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。